(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 7 月 16 日 (16.07.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/149602 A1

(51) 国际专利分类号:
H10P 72/30 (2026.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2026/078448

(22) 国际申请日: 2026 年 2 月 11 日 (11.02.2026)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202510455679.1 2025年4月11日 (11.04.2025) CN

(71) 申请人:杭州朗迅科技股份有限公司(**HANGZHOU LUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号1幢（南）5楼E5029室 311000 (CN)。

(72) 发明人: 徐振 (**XU, Zhen**); 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号1幢（南）5楼E5029室 311000 (CN)。 刘恩典 (**LIU, Endian**); 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号1幢（南）5楼E5029室 311000 (CN)。 周丹锋 (**ZHOU, Danfeng**); 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号1幢（南）5楼E5029室 311000 (CN)。

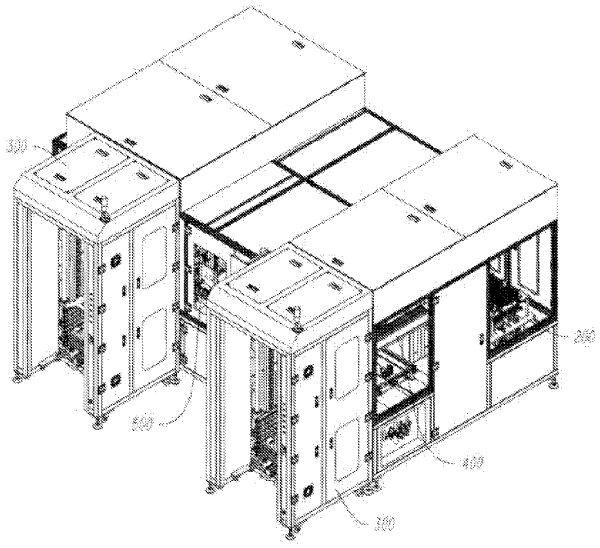
(74) 代理人:上海迎向知识产权代理事务所（普通合伙） (**SHANGHAI TOWARDS INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY**); 中国上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区松林路357号2012室 200122 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,

(54) **Title:** BATCH LOADING AND UNLOADING DEVICE AND METHOD FOR BURN-IN APPARATUS

(54) 发明名称: 一种老化设备批量上下料装置和方法

[图1]



(57) **Abstract:** The present invention relates to the technical field of automation apparatuses. Provided are a batch loading and unloading device and method for a burn-in apparatus. The batch loading and unloading device for a burn-in apparatus comprises a tray loading and unloading assembly, a board loading and unloading assembly, a cover opening assembly, a cover closing assembly, a pre-testing assembly and a transfer assembly. The device is used in the batch loading and unloading method for a burn-in apparatus, and by means of the tray loading and unloading assembly, the board loading and unloading assembly, the cover opening assembly, the cover

WO 2026/149602 A1

[见续页]

CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MU, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。
— 在修改权利要求的期限届满之前进行，在收到该修改后将重新公布(细则48.2(h))。
— 根据申请人的请求，在条约第21条(2)(a)所规定的期限届满之前进行。

closing assembly, the pre-testing assembly and the transfer assembly, a full-process closed-loop operation of the automatic loading and unloading of chips and boards, cover opening and closing, pre-testing and abnormality handling is realized, and the fully automatic operation of the batch loading and unloading of the burn-in apparatus is realized, thereby improving the batch loading and unloading efficiency of the burn-in apparatus. The pre-testing assembly can promptly detect a fault of a chip and a tool on a board, can specifically determine whether the chip or the tool is abnormal by means of an exchange structure, and promptly handles the abnormal chip or tool, thereby preventing the abnormal chip or tool from being subjected to a burn-in test, and thus improving the efficiency of burn-in testing.

(57) 摘要: 本发明提供一种老化设备批量上下料装置和方法，涉及自动化设备技术领域。老化设备批量上下料装置包括托盘上下料组件、板卡上下料组件、开盖组件、关盖组件、预测试组件和移栽组件。老化设备批量上下料方法利用该装置，通过托盘上下料组件、板卡上下料组件、开盖组件、关盖组件、预测试组件及移栽组件，实现芯片与板卡的自动上下料、开闭盖、预测试及异常处理的全流程闭环操作，实现老化设备批量上下料的全自动化操作，提升老化设备批量上下料的效率；预测试组件可以及时发现芯片或板卡上的工装的故障，并可以通过调换结构确认具体是芯片或工装的异常，及时对异常的芯片或工装进行处理，避免将异常的芯片或工装进行老化测试，提升老化测试的效率。